

# テスター装着用 デバイス 温特試験システム

PDT-4408

テスターのセットはプローブで自動脱着  
-40°Cから+120°C 半導体温度特性試験機



システム構成写真



テスター装着

## 特 長

- ✦ ペルチェ素子でデバイスに直接熱伝達、素早い温度変化
- ✦ プローブ型熱電対でパッケージ表面温度を精密温度制御 ( $\pm 0.1^\circ\text{C}$ )
- ✦ テスターの装着はプローブで自動化。コンパクト設計で移動も簡単
- ✦ 結露防止用窒素ガスパージ構造付き (オプション: 窒素ガス発生装置装着可能)
- ✦ 検査デバイスは8個、駆動ペルチェ素子は4素子温度制御

## 仕 様

型 式	PDT-4408
使用ペルチェ素子	UT-4040X4個
放熱方式	不凍液循環冷却方式
温度範囲 (°C)	-40°C~+120°C
温度センサー	プローブ型K熱電対
外形寸法 (mm)	550 x 800 x 1500 h
温調ヘッド部 (mm)	80 x 230
温度制御装置	FC-4640型 (4CH制御)
電源電圧	AC-100V/200V 25A

\* 温調ヘッド部の寸法形状は御社のご要望のサイズに設計いたします。